

ZEM 15

Компактный настольный электронный микроскоп



Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM 15 позволяет проводить анализ образцов с высоким увеличением и разрешением, а также осуществлять сбор данных об их элементном составе. Компактные размеры и эргономичный дизайн обеспечивают простоту использования, возможность установки СЭМ на обычный стол в любом помещении – как в офисе, так и на производстве. Источник электронов – вольфрамовая нить – позволяет пользователю проводить замену катода микроскопа.

Основные преимущества:

- разрешение и увеличение соответствуют большинству требований к тестированию образцов с помощью электронной микроскопии;
- базовая модель, позволяющая устанавливать все основные типы детекторов (SE, BSE, EDS);
- компактные размеры, легкая установка и ввод в эксплуатацию, минимальные требования к месту установки;
- простота в эксплуатации, быстрая загрузка и замена образца, а также возможность дооснащения специальными столиками для испытаний;
- низкая стоимость и доступность источника электронов – катода из вольфрамовой нити, замена которого осуществляется пользователем самостоятельно.

Технические характеристики

Тип катода	Вольфрамовая нить
Максимальное разрешение, нм	8
Максимальное увеличение, х	150 000
Ускоряющее напряжение, кВ	15
Детекторы: обратно-рассеянные, электроны вторичные электроны, ЭДС	Опция
Предметный столик, ход по осям X и Y, мм	30 × 30
Максимальный размер образца, мм	Ø 50
Максимальная высота образца, мм	35
Время загрузки образца до получения изображения в электронах, с	90
Оптическая цифровая навигационная камера	Цветное изображение

